

祐銓科技股份有限公司

Your Chance Technology CO., LTD.

Made in Taiwan



精準 · 創新 · 滿意



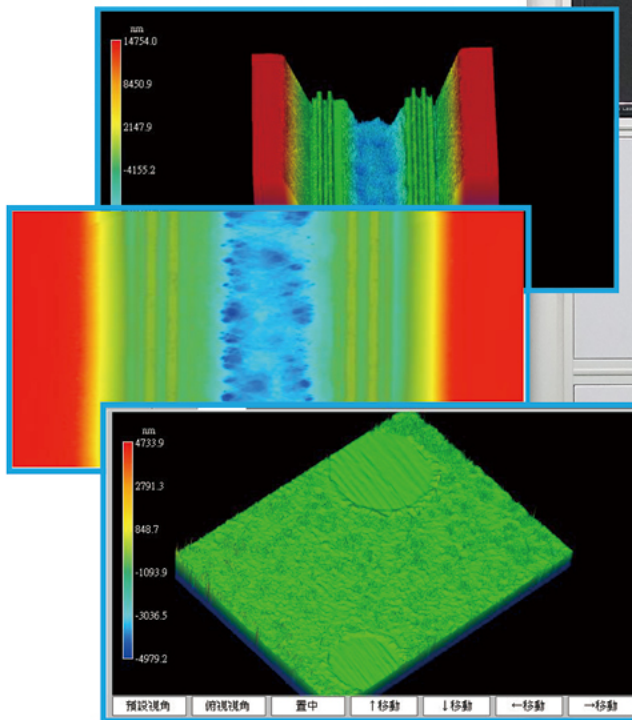
奈米深度3D奈米深度量測儀

■ 奈米深度3D奈米深度量測儀 SCM系列

■ 奈米深度3D形狀顯微檢測儀的檢測應用

結合光學顯微鏡與白光干涉儀的功能掃描式白光干涉顯微鏡，結合顯微物鏡與干涉儀，不需要複雜光路調整程序，兼顧體積小、奈米解析度、易學易用等優點，可提供垂直掃描高度達400 μm 之微大三維量測，適合各種材料與微元件表面物徵和微尺寸檢測。應用領域包含：

- 晶圓 (Wafer)
 - 光碟／硬碟 (DVD Disk / Hard Disk)
 - 微機電元件 (MEMS Components)
 - 平面液晶顯示器 (LCD)
 - 高密度線路印刷電路板 (HDI PCB)
 - IC封裝 (IC Package)
- 以及其它材料分析與元件微表面研究



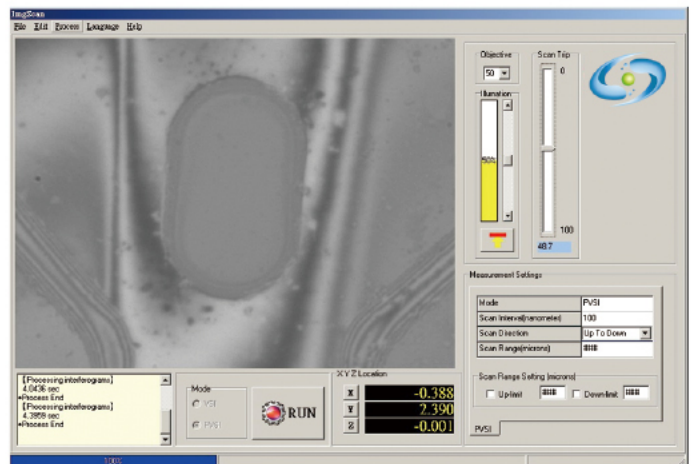
■ 高解析自動奈米深度量測儀 SCM-4000A

- 自動對焦
- 自動跑位(400mmX400mm)
- 程式化管理
- 連線管理

* 機台解析度，精度等規格，請見第5頁

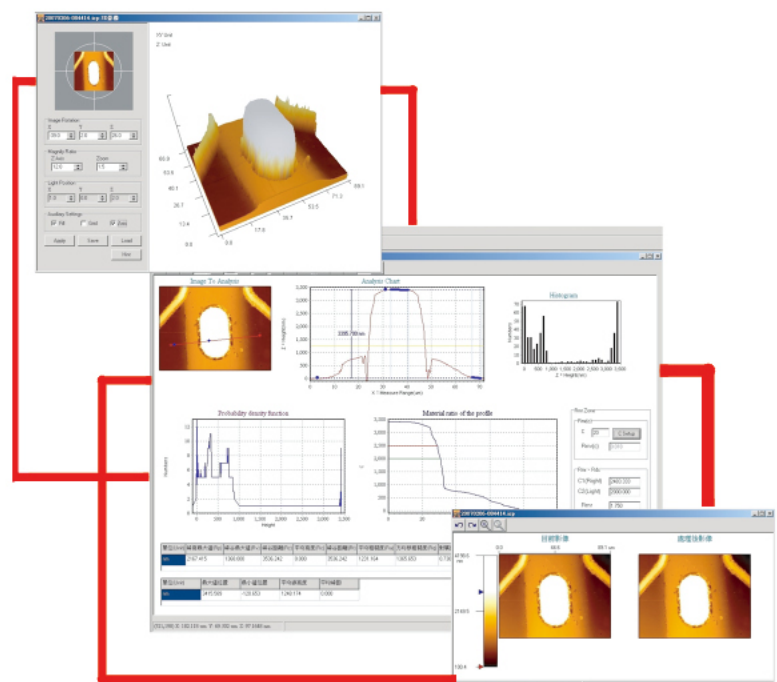
■ 高速精密的干涉解析軟體 (ImgScan)

- 系統硬體搭配ImgScan前處理軟體自動解析白光干涉條紋。
- 垂直高度可達0.1nm。
- 高速的分析演算法則，讓您不再苦候量測結果。
- 垂直掃描範圍的設定輕鬆又容易。
- 10X, 20X與50X倍率的物鏡可供選擇。
- 平台XYZ位置數顯式顯示，使檢測標的尋找快速又便利。
- 具手動／自動光強度調整功能以取得最佳的干涉條紋對比。
- 具高精度的PVSII與高速的VSI掃描量測模式供選擇。
- 具專利的解析演算法則可處理半透明物體的3D形貌。
- 具自動補點功能。
- 可自行設定掃描方向。



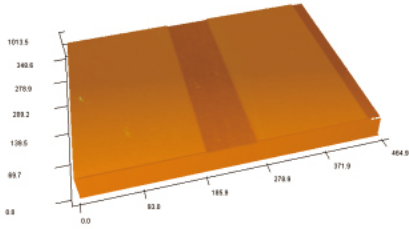
■ 專業級的3D圖形處理與分析軟體軟體 (PostTopo)

- 提供多功能又具親和介面的3D圖形處理與分析。
- 提供自動表面平整化處理功能。
- 提供高階標準片的軟體自校功能。
- 深度／高度分析功能提供線型分析與區域析等兩種方式。
- 線型分析方式提供直接追溯ISO定義的表面粗糙度(roughness)與起伏度(waviness)的量測分析。可提供多達17種的ISO量測參數與4種額外量測數據。
- 區域分析方式提供圖形分析與統計分析。具有平滑化，銳化與數位濾波等多種二維快速傅利葉轉換(FFT)處理功能。
- 量測分析結果以BMP等多種圖形檔案格式輸出或是以Excel文字檔案格式輸出。

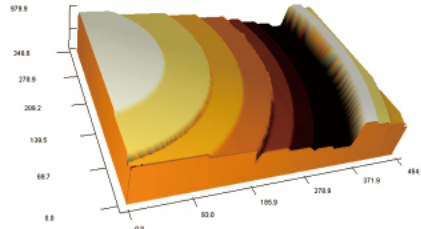




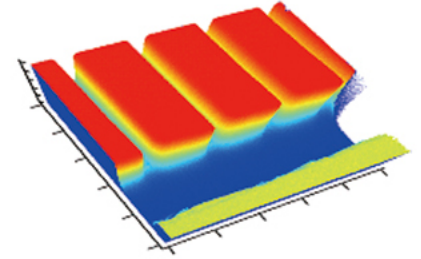
■ 檢測範例



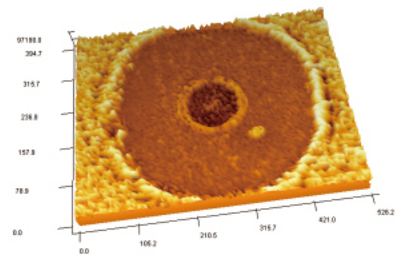
階高標準片(深度：28 nm)



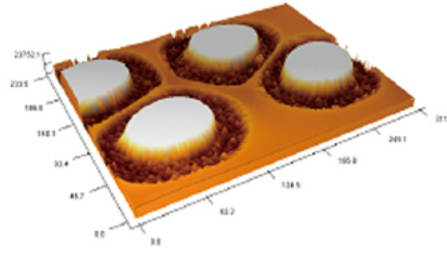
繞射光學微元件(高度：452 nm)



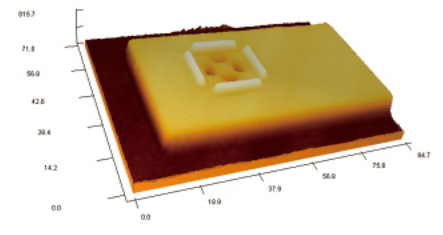
光波導元件(高度：38 μm)



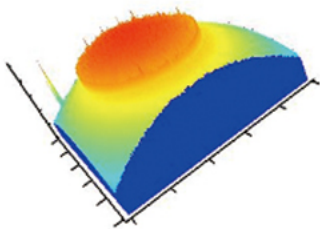
PCB微鑽孔(深度：30 μm)



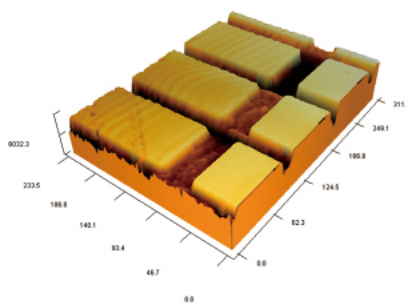
LCD背光板模組(高度：12 μm)



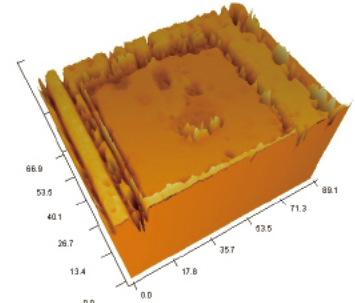
IC微影疊對標記(高度：1 μm)



光纖與陶瓷套筒端面



LCD彩色濾光板PGB層



IC晶片凸塊

■ 機台規格：以下為標準機台規格另可依客戶需求增加電動平台或自動對焦模組

型號		SCM1510MS		
物鏡放大倍率		10 X	20 X	50 X
觀察與量測範圍 (長X寬)單位: mm	標準型	0.43 X 0.32	0.21 X 0.16	0.088 X 0.066
	增強型	1.67 X 1.33	0.84 X 0.67	0.34 X 0.27
光學解析度(μm)		1.12	0.84	0.61
工作距離(mm)		7.4	4.7	3.4
量測用光學系統		白光干涉顯微光學系統		
高度測量	測量範圍	100 μm (400 μm, 選配)		
	量測解析度	0.1 nm		
	重覆精度(σ) ⁽¹⁾	≦ 0.1 % (量測高度 : > 10 μm) ≦ 10 nm (量測高度 : 1 μm ~ 10 μm) ≦ 5 nm (量測高度 : < 1 μm)		
	量測控制	自動		
	掃瞄速度(μm/s)	12 (最快)		
觀察與量測用光源	光源類型	儀器用鹵素光源		
	平均使用壽命	1000小時		
	光強度調整	自動/手動		
取像單元	影像感測器	黑白CCD數位攝像機		
	感測器解析度	標準型	640 x 480 像素	
		增強型	1280 x 1024 像素	
樣品移動平台	觀察移動平台	行程	150 mm x 100 mm , 手動	
		載重	大於10 kg	
	Z 軸移動範圍	80 mm , 手動		
	位置數位顯示單元	三軸光學尺與三軸數位顯示器(解析度1 mm)		
	傾斜調整平台	手動		
	底座	花崗岩		
	資料處理與顯示用電腦	中央處理運算單元	雙核心CPU	
影像與資料顯示螢幕		液晶螢幕		
存儲裝置		200 GB 以上硬碟機		
作業系統		Windows 7 ⁽²⁾ / office 專業版		
電源	AC100V~240V , 50Hz / 60Hz			
重量	約150 kg (含花崗岩底座)			
分析軟體	Windows7相容的影像擷取與分析軟體, 包含ISO粗糙度/階高分析, 快速傅利葉轉換和濾波, 多樣的2D和3D觀測視角圖, 外形/面積/體積分析, 圖像縮放, 標準影像檔案格式轉換, 報表輸出等等。			
階高標準片(選配)	提供50 nm~150mm多種規格			
機臺尺寸(mm)	510 X 560 X 900			

- 1.使用20X物鏡量測階高標準重覆30次的結果
2. Windows7為美國Microsoft公司註冊商標
- 3.環境振動：VC-C等級以上

※實際規格以出貨為準※

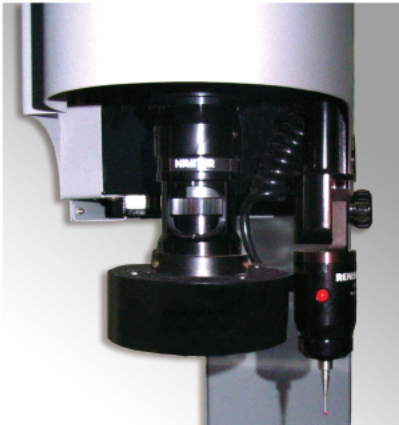


全系列影像測量儀

All Series Video Measuring Machine (AVM)

影像測量儀以二維測量為主，包括點、線、圓弧和矩形等幾何元素，以及零件的長度、角度、輪廓外形和表面形狀等。同時也能做2.5D測量，如臺階的高度、孔或槽的深度等，已廣泛的應用於機械、電子、儀錶、塑膠等行業。本公司全系列採用花崗岩平臺，外觀簡潔大方，結構穩定，防震效果佳，測量軟體功能齊全，可應付各種產業二維尺寸測量的需求。

- 強大的複合功能，同時支援2D影像與3D接觸探頭量測，提供一機多用的解決方案。



簡易探針



3D介面

- 支援多種物鏡系統，搭配高解析度光學尺，提供精微零件高精度的顯微影像檢測。



同軸光鏡頭



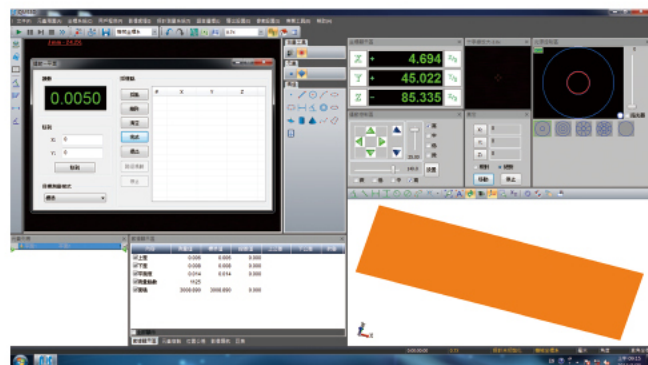
自動變倍鏡



同軸金相鏡頭



雷射掃描

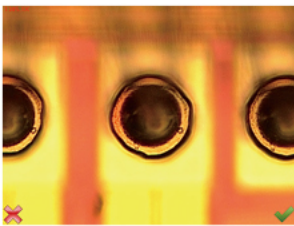


雷射掃描介面

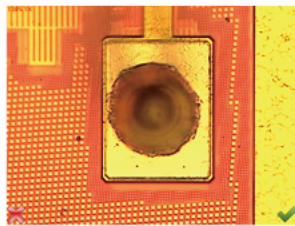
■ 高精度自動焊線量測儀(WM-5000II)

● 特點

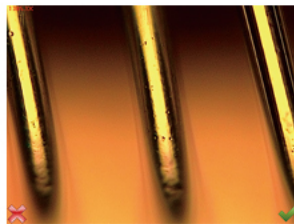
1. 自動量測避免人為量測的誤差。
2. 統一量測定義，與規範。
3. 執行程式下載，資料上傳追蹤方便。
4. 高重複精度，精度。
5. 節省操作人力。
6. 報表格式名稱自行定義。
7. 可選配SECS功能。
8. 可選配自動Load / Unload功能。



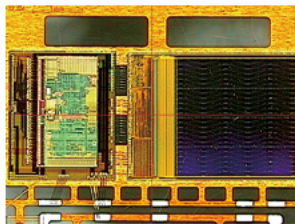
球大小 (Ball Size X, Y)



球厚度 (1st Ball Height)



弧高 (Loop Height)



多晶片 (MCP ,Stack Dies)

* 2nd焊點,SSB...自動量測



■ 技術規格參數

型號		
X, Y, Z行程	X軸	350 mm
	Y軸	300 mm
	Z軸	150 mm
	金屬台尺寸	570X470mm ²
驅動控制系統	獨立伺服器馬達控制	
X/Y軸光學尺解析度	0.5 μm	
Z軸光學尺解析度	0.1 μm	
X/Y坐標標示誤差	≤(2+L/100)	
影像系統	· 攝像CCD：彩色1/2 CCD · 物鏡：日系高解析鏡頭 · 物鏡倍率：5X、20X、50 X · 視頻倍率：136X - 1367X	
量測軟體	QC3000	
光源	LED	
儀器重量	700 kg	
外型尺寸	1200X1300X1820mm(不含指示燈)	
功率	500 W(不含電腦、螢幕)	
工作電壓	220 V (單向)	



■ 大行程全自動影像測量儀

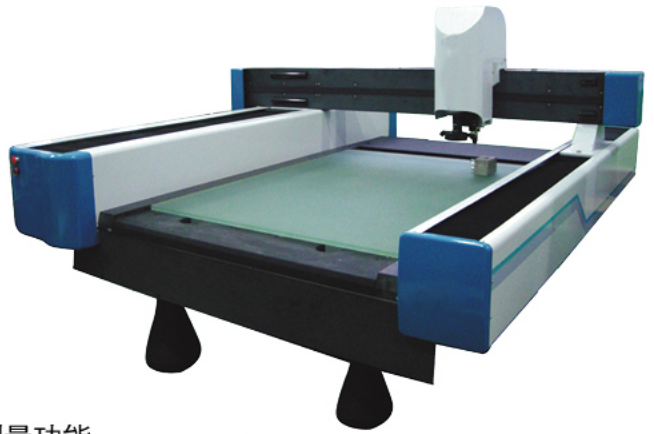
● 用途

本系列產品採用氣浮和伺服控制技術，結合本公司自主研發的QMS3D自動測量軟體，可實現高效、準確的大批量工件測量，適用於精密零部件的檢測和品質控制。在機械、電子、五金、塑膠等行業中都得到了廣泛的應用。

● 特點

1. 行程大，測量範圍更廣
2. 自主開發QMS3D軟體，可滿足客戶不同測量需求
3. 具有快速自動對焦、自動尋邊，強大的程式設計和自動測量功能
4. 採用亞圖元細分技術，提高邊界分辨能力
5. 配置操縱手柄，亦可軟體程式控制
6. SPC資料處理分析，大批量治具測量
7. X、Y、Z三軸伺服控制，定位精度高速度快，運行平穩
8. 採用自主開發的嵌入式模組控制系統，將複雜的控制系統集成於儀器內部，穩定性更高
9. 程式控制恒流驅動式八區表面冷光光源，可適應複雜的工件測量
10. X、Y向導軌採用高精度花崗石，具有高穩定性及剛性，不易變形
11. X、Y向移動的部份採用低摩擦，高速度，高精度的氣浮移動導向系統
12. 採用同步帶或絲桿傳動，精度高，穩定性好
13. 花崗石直線度和玻璃平面度好，花崗石導軌無摩擦、不磨損
14. 可通過鐳射指示器尋找被測工件的具體位置，快速定位，方便快捷

※可選配自動變倍鏡頭、同軸光鏡頭、鐳射位移器、簡易測頭、白光納米檢測模組



■ 技術規格參數

型號	AVM-6060C	AVM-6090C	AVM-0810C	AVM-1012C	AVM-1215C	
工作台	玻璃台尺寸(mm)	640×770	640×1070	885×1208	1085×1408	1285×1708
	運動行程(mm)	600×600	600×900	800×1000	1000×1200	1200×1500
X、Y、Z、軸數顯分辨率	0.5 μm					
示值誤差	$E1XY=(2.5+L/200) \mu m$		$E1XY=(3.0+L/200) \mu m$			
外形尺寸(長×寬×高)mm	1500×1300×1510	1800×1300×1510	2170×2380×1560	2370×2580×1560	2570×2880×1560	
儀器重量(kg)	1281	1500	3260	3750	4520	
Z軸升降行程	150mm		200mm			
功率	1000W(不包含電腦)		1500W(不包含電腦)			
影像系統	攝影機：1/2" 彩色CCD攝像機					
	變倍鏡頭倍率：0.7X~4.5X 視頻倍率 23.5X~148X					
	物方視場：11.1mm~1.7mm					
電源	AC 100V~240V 50/60Hz					
氣源壓力	≥0.5MPa					
空氣流量	120L/min(0.4MPa)					
溫度範圍	20±2°C <2°C/24h <1°C/m					
濕度	55%~65%					

■ 大行程全自動影像儀(線軌)

● 用途

AVM-0606L/0810L是全自動型大工作範圍的影像測量儀，X、Y軸採用線性導軌式結構，以二維測量為主，也可以作三維輔助測量。

● 特點

1. 自主開發QMS3D軟體，可滿足客戶不同測量需求
2. 具有快速自動對焦、自動尋邊，強大的編程和自動測量功能
3. 採用亞像素細分技術，提高邊界分辨能力
4. 配置操縱手柄，亦可軟件程控
5. SPC數據處理分析，大批量具測量
6. X、Y、Z三軸伺服控制，定位精度高速度快，運行平穩
7. 採用自主開發的嵌入式模塊控制系統，將複雜的控制系統集成於儀器內部，穩定性更高
8. 程控恆流驅動式八區表面冷光光源，可適應複雜的工作測量
9. 可通過激光指示器尋找被測工作的具體位置
10. 可配置自動變倍鏡頭、同軸光鏡頭、激光位移器、RENISHAW簡易探針
11. 採用線性導軌型式，無需供氣，出貨後無需在客戶那裡進行裝調，可拆下包裝後直接使用
12. 固定式玻璃工作臺及00級花崗岩平臺底座，穩定性好，承載量大，精度高，可測量較大
13. 高速進行測量，提高測量效率



■ 技術規格參數

型號	AVM-0606L		AVM-0810L	
工作台	玻璃台尺寸(mm)	700×1190		900×1588
	運動行程(mm)	600×600		800×1000
X、Y、Z、軸數顯分辨率	0.5 μm			
示值誤差	$E_{1XY}=(3.5+L/200) \mu m$			
外形尺寸(長×寬×高)mm	1390×1300×1600		1790×1500×1600	
儀器重量(kg)	1500		1900	
Z軸升降行程	200mm			
X/Y軸最大速度	400mm/s			
影像系統	攝影機：1/2" 彩色CCD攝像機 變倍鏡頭倍率：0.7X~4.5X 視頻總倍率：23.5X~148X 物方視場：11.1mm~1.7mm 電源：AC 100V-240V 50/60Hz 功率：1800W(不包含電腦)			

※實際規格以出貨為準※



■ 落地式全自動影像儀(AVM-5040C)

● 用途

- 該儀器適用於以二維測量為主的應用領域，也可作三維輔助測量。在機械、電子、儀錶、塑膠等行業被廣泛應用。

● 特點

1. 整機一體化人機工程設計，方便操作測量。
2. 具有快速自動對焦，自動尋邊，自動測量功能，大大提高檢驗效率。
3. 可選配自動變倍功能，無需圖元校正實現多倍率下高效測量
4. 自主開發QMS3D軟體，可滿足客戶不同測量需求
5. 採用亞圖元細分技術，提高邊界分辨能力
6. 配置操縱手柄，亦可軟體程式控制
7. SPC資料處理分析，大批量治具測量
8. X、Y、Z三軸伺服控制，定位精度高速度快，運行平穩
9. 採用自主開發的嵌入式模組控制系統，將複雜的控制系統集成於儀器內部，穩定性更高
10. 程式控制恒流驅動式八區表面冷光光源，可適應複雜的工件測量
11. 可通過鐳射指示器尋找被測工件的具體位置，快速定位，方便快捷



AVM-5040C

※可選配自動變倍鏡頭、同軸光鏡頭、鐳射位移器、簡易測頭、白光納米檢測模組

■ 技術規格參數

型號		AVM-5040C	
工作 台	金屬台尺寸(mm)	786×636	
	玻璃台尺寸(mm)	570×470	
	運動行程(mm)	470×370	
X、Y、Z軸數顯分辨率		0.5 μm	
坐標示值誤差		$E_{1XY}=(2.5+L/100)$	
外形尺寸(長×寬×高)mm		1200×1270×1870	
儀器重量(kg)		850	
Z軸升降行程		200mm (可訂購至400mm)	
影像系統	攝影機	1/2" 彩色CCD攝像機	變倍鏡頭倍率：0.7X~4.5X
	視頻總倍率	23.5X~148X	
	物方視場	11.1mm~1.7mm	
電源：AC 100-240V 50/60Hz 功率：400W(不包含電腦)			

※實際規格以出貨為準※

■ CNC型影像測量儀(CNC Type Video Measuring Machine)

AVM-C 系列

- AVM-C系列CNC型影像測量儀，具有以下優越的特點：
 - 1.支援自動對焦、搖桿操作、以及接觸式探針測量。
 - 2.軟體支援強大元素構造, 多元化測量方法(自動尋邊、對比測量以及局部放大採點)等。
 - 3.嵌入式模組伺服控制驅動馬達，機電回應速度快速。
 - 4.雙重閉環運動控制，具有精確的高速運動定位性能。
 - 5.精簡化儀器與電腦介面。
 - 6.花崗岩平臺，結構穩定，抗震能力佳。
 - 7.獨立控制的冷光表面與底部光源。
 - 8.配有專用QMS3D二維量測軟體，具教導功能
可大幅提高批量測量效率。
 - 9.進口滾珠驅動螺桿與滑軌，機械性能佳。
 - 10.國外品牌攝像機與光學變焦鏡頭。
 - 11.具高精密鏡頭選配模組，光學解析度達0.6微米。



AVM-4030C

■ 小行程 CNC型 AVM-C系列

儀器型號		AVM-3020C	AVM-4030C
工作臺行程	X軸(mm)	270	370
	Y軸(mm)	170	270
	Z軸(mm)	150 (對焦用)	
	玻璃面尺寸(mm)	350 x 250	450 x 350
	金屬台尺寸(mm)	500 x 330	606 x 466
驅動控制系統		獨立伺服馬達控制	
座標顯數解析度		0.5 μm	
X/Y座標示值誤差		≤ (3 + L / 200) μm L為被測長度，單位:mm	
影像系統		<ul style="list-style-type: none"> ● 攝像CCD：彩色1/2" CCD攝像機。 ● 物 鏡：手動定格變倍鏡頭 ● 物鏡倍率：0.7X-4.5X ● 視頻倍率：23.5X-148X ● 物方視野：11.1 - 1.7mm 	
量測軟體		QMS3D	
光 源		表面光源與透射光源均採用LED，亮度可調。	
儀器重量 (kg)		223	321
電 源		AC100V~240V 50/60 Hz	
外型尺寸 (mm)		775 x 750 x 1100	923 x 850 x 1140
功 率		250W (不包含電腦)	

以下功能強化選購件請參閱影像測量儀附件說明

- 儀器標準配備及一般選購件 (0.5X 附加鏡， 2X 附加鏡，0.5X 鏡筒)
- 高精度選購件 (5X，10X，20X，50X超長工作距離物鏡)

※實際規格以出貨為準※



■ 手動型影像測量儀

MVM-5040M系列

● 產品特點

- 整機一體化人機工程設計，方便操作測量
- 工作臺一鍵式氣動單手快速移動操作
- Z軸三種速度模式選擇對焦
- 搭配自主開發QMS3D-M軟體，可滿足不同客戶需求
- 被動式裝置，提高整機精度穩定性

● 產品用途

- 該儀器適用於以二座標測量為目的的一切應用領域，在機械、電子、儀錶、塑膠等行業被廣泛應用。



MVM-5040M

■ MVM-5040M系列

儀器型號	MVM-5040M
變倍鏡頭	手動定倍鏡頭 倍率 0.7X-4.5X
光源	上光源-LED表面環形光源 底光源-LED新型平行光源
光學尺解析度(μm)	0.0005mm (0.5 μm)
示值誤差(μm)	$E_{1XY} = (2.8+L/75)$; L: 測量長度, 單位mm
攝像機	彩色1/2" 攝像機
視頻總倍率	23.5X~148X
物方視場(mm)	11.1mm~1.7mm
X/Y軸行程(mm)	500X400
玻璃台尺寸(mm)	570X470
金屬台尺寸(mm)	786X636
Z軸運動行程(mm)	200
外形尺寸(mm)	1200X1270X1870
整機重量(kg)	850

※實際規格以出貨為準※

■ 手動型影像測量儀

實用標準 **MVM-D** 系列

性能增強 **MVM-S** 系列

● 產品應用：

本儀器適用以2D平面尺寸測量的所有應用領域，在機械,電子,儀錶,塑膠等行業已被廣泛使用。

● 產品特色：

- 1.使用RS-232接口與電腦連接並採用專用QMS3D-M測量軟體，具有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能，可對測量繪圖形進行處理及輸出。
- 2.具工件擺正功能，免除工件對正不易的困擾。



■ MVM-S/D 系列規格：

儀器型號	MVM-1510S/D	MVM-2010S/D	MVM-2515S/D	MVM-3020S/D	MVM-4030S/D
工作臺金屬臺面尺寸 (mm)	354 x 228	404 x 228	450 x 280	500 x 330	606 x 466
工作臺玻璃臺面尺寸(mm)	210 x 160	260 x 160	306 x 196	350 x 250	450 x 350
工作臺運動行程 (mm)	150 x 100	200 x 100	250 x 150	300 x 200	400 x 300
儀器重量(kg)	100	110	120	140	240
外型尺寸 (mm)	540 x 560 x 860		760 x 600 x 900		970 x 670 x 940
Z 升降行程 (mm)	200 mm				
Z 軸工作距離 (mm)	MVM-S 系列: 92 mm		MVM-D 系列: 105 mm		
X/Y 坐標示值誤差	$\leq (3 + L / 200) \mu\text{m}$ L: 為被測長度, 單位: mm				
量測軟體	QMS3D-M				
影像系統	MVM-S 系列				
	<ul style="list-style-type: none"> ● 攝像CCD：彩色1/2" CCD攝像機。 ● 物 鏡：採用 NAVITAR 鏡頭，物鏡倍率 0.7X-4.5X，視頻倍率 23.5X-148X，物方視場 11.1 mm - 1.7 mm。 				
影像系統	MVM-D 系列				
	<ul style="list-style-type: none"> ● 攝像CCD：彩色1/3"CCD攝像機。 ● 定格物鏡：物鏡倍率 0.7X-4.5X，視頻倍率 33X - 195X，物方視場 8.1 mm - 1.3 mm。 				
照明光源	表面光源與透射光源均採用LED，亮度可調				
電源	AC100V~240V 50/60 Hz				
選配件	3M、十字線				
功率	50W (不包含電腦)				
建議放置台：載重需 ≥ 350 kg；尺寸(長 x 寬 x 高)：1,000 x 600 x 650 (mm)					

以下功能強化選購件請參閱影像測量儀附件說明

- 儀器標準配備及一般選購件 (0.5X 附加鏡，2X 附加鏡，0.5X 鏡筒)
- 高精度選購件 (5X，10X，20X，50X超長工作距離物鏡)

※實際規格以出貨為準※



■ 半自動型影像測量儀

● 用途

該儀器適用於以二維坐標測量為目的的一切應用領域，在機械、電子、儀表、塑料等行業被廣泛應用。

● 特點

1. 程控恒流驅動式八區表面冷光光源，可適應複雜的工件測量。
2. 自主開發QMS3D-C軟體，和高清晰1/3"彩色攝像機。
3. 可通過鐳射指示器尋找被測工件的具體位置，可適應複雜的工件測量。
4. 可實現高度輔助測量。
5. 採用T型槽工作臺，方便各種夾治具的安裝不受控制。
6. 光柵尺分辨力為0.5 μm 。
7. 腳踏開關與軟件配合，操作簡便。
8. Z軸三種速度模式選擇對焦。



MVM-3020MZ

■ 技術規格參數

型號		MVM-3020MZ	MVM-4030MZ
工作 台	金屬台尺寸(mm)	500×330	606×466
	玻璃台尺寸(mm)	350×250	450×350
	運動行程(mm)	300×200	400×300
X、Y、Z、軸數顯分辨力		0.5 μm	
示值誤差(μm)		$E_{1XY}=2.5+L/100$	
外形尺寸(長×寬×高)mm		760×600×900	970×670×940
儀器重量(kg)		168	266
Z 軸升降行程		150mm	
影像系統	攝影機：彩色1/3" CCD	變倍鏡頭倍率：0.7X~4.5X	
	視頻總倍：33X~195X	物方視場：8.1mm-1.3mm	
電源：100~240V 50/60Hz 功率：10W(不包含電腦)			

※實際規格以出貨為準※

■ 儀器標準配備及一般選購件 (0.5X附加鏡，2X附加鏡，0.5X鏡筒)

儀器配件	1X 鏡筒 (標準配備)		0.5X 鏡筒 (選配)		工作距離 (mm)
	視頻倍率	物方視場 (mm)	視頻倍率	物方視場 (mm)	
雙焦鏡	0.7X-4.5X		0.7X-4.5X		175
附加鏡	11.8X-74X	22-3.4	5.9X-37X	44-6.8	
0.5X(選配)	23.5X-148X	11.1-1.7	11.8X-74X	22-3.4	
標準配備	47X-296X	5.5-0.9	23.5X-148X	11.1-1.7	
2X(選配)					

※實際規格以出貨為準※

■ 高精度選購件 (5X，10X，20X，50X超長工作距離物鏡)

儀器配件	1X鏡筒(選配)		2X鏡筒(選配)		工作距離 (mm)
	光學放大倍率	物方視場 (mm)	光學放大倍率	物方視場 (mm)	
同軸光雙焦鏡	0.7X-4.5X (選配)		0.7X-4.5X (選配)		13
物鏡	1.74X-11.43X	4.05 ~ 0.70	3.48X-22.86X	2.30 ~ 0.35	
5X (選配)	3.48X-22.86X	2.10 ~ 0.35	6.96X-45.72X	1.15 ~ 0.17	
10X(配備)	6.96X-45.72X	0.91 ~ 0.17	17.40X ~ 114.30X	0.57 ~ 0.09	
20X(選配)	17.40X ~ 114.30X	0.31 ~ 0.07	34.80X ~ 228.60X	0.23 ~ 0.04	
50X (選配)	150 W 鹵素光源與光源傳輸光纖 (選配)				

※實際規格以出貨為準※

■ T 接觸式測頭系統

型號	RENISHAW MCP接觸探頭		
感應方向	5 軸, +/-X, +/-Y, +Z	單向重覆性	0.75 μm (2σ)
觸發力量(固定)	12g 標稱值	探頭固定螺孔	M3
探頭狀態顯示	LED 顯示	探頭訊號接頭	5 Pin DIN
行程限度(Z軸)	5mm	行程限度(X/Y軸)	+/- 20度

※實際規格以出貨為準※

■ 影像型工具顯微鏡

TMM-S系列

● 產品特色：

- XYZ三軸0.0005 mm解析度
- 高精度非接觸式光測高度量測模組
- 具Z軸粗細調轉盤
- 同軸表面光／底光量測
- 內建偏光量測光學模組
- 可量測透明材質高度差

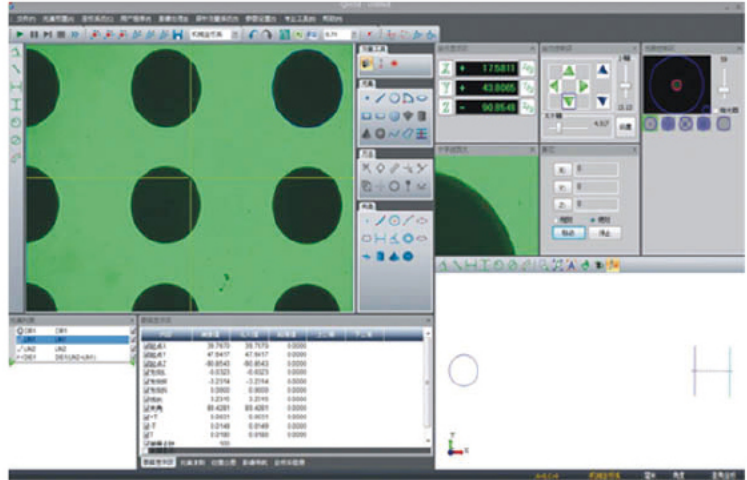


■ TMM-S/D 系列規格：

儀器型號	TMM-1510S	TMM-2010S	TMM-3020S	
工作臺金屬臺面尺寸 (mm)	354 x 228	404 x 228	500 x 330	
工作臺玻璃臺面尺寸(mm)	210 x 160	260 x 160	350 x 250	
工作臺運動行程 (mm)	150 x 100	200 x 100	300 x 200	
儀器重量(kg)	100	110	140	
外型尺寸 (mm)	590 (左右手輪距離) x 560(前面板到後花崗石) x 850(腳墊底部到保護鍊頂部)		590 x 720 x 850	
Z 軸工作距離 (mm)	120			
XYZ軸光學尺解析度	0.0005 mm (0.5 μm)			
X/Y 坐標示值誤差	$\leq (3 + L / 200) \mu\text{m}$ L: 測量長度, 單位: mm			
量測軟體	QMS3D-M			
影像系統	彩色1/2" CCD攝像機, 640 x 480			
顯微鏡系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 三目頭 ● 目鏡: 10倍 ● 濾光片: 紅, 藍, 綠 ● 量測模式: 反射, 透射, 偏光 ● 5 孔物鏡轉換鏡 			
照明光源	<ul style="list-style-type: none"> ● 透射照明光源: 綠光LED, 亮度可調 ● 同軸照明光源: 鹵素燈, 亮度可調 			
電源	AC 110V 50/60Hz (標準), AC 220V 50/60Hz (選配)			
功率	< 60W(不包含電腦)			
物鏡				
倍率	5X	10X	20X	50X
工作距離(mm)	20.0	18.3	8.8	2.0
視野FOV (mm)	1.23 x 0.91	0.62 x 0.46	0.31 x 0.23	0.12 x 0.09
選配件				
高度量測模組	光干涉高度量測模組 10X			
建議				
放置台	載重量 \geq 350 kg, 尺寸(長 x 寬 x 高): 1,000 x 600 x 500 (mm)			

■ QMS3D 系列

該系列測量軟體是我公司自主開發的多傳感器測量應用軟體，可以對二維測量的坐標進行可視化分析處理和檢測，也可以使用探針進行三維幾何元素測量，還可以使用雷射位移器測量平面度和高度。該軟體廣泛應用於各種精密製造業，如手機組件、模具、電子、通信、機械、五金、塑膠、儀表、鐘錶、PCB、LCD等行。可測量的材料包括金屬、塑膠、橡膠、玻璃、PCB、陶瓷等。



● 軟體共同特點：

1. 提供影像和探針測量各種基本幾何元素，例如：點、直線、圓、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、平面等。
2. 可輸出Word、Excel報表和AutoCAD文件。
3. 具有專業SPC統計功能，可進行有效的品管控制。
4. 軟體界面直觀,功能操作簡單方便。
5. 提供功能強大、操作方便的用戶測量程序。
6. 完全支持WIN7 32位元系統和16：9英寸寬屏顯示器。
7. 提供繁體中文、簡體中文和英文三種語言界面。

■ QMS3D 系列規格:

軟體功能	
QMS3D	QMS3D-M
(1) 提供影像、探針和雷射位移器測量功能。 (2) 提供多種形式報表功能。 (3) 提供治具測量、掃描、影像導航、多種測量和構造方法的功能。 (4) 強大靈活的機台控制功能：包括鼠標控制機台運動，鏡頭自動變倍、自動對焦及光源控制，提供多種方式控制X、Y、Z軸運動等。 (5) 提供方便的像素校正功能。	(1) 提供影像和探針測量功能。 (2) 提供輔助對焦，多種測量和構造方法的功能。 (3) 提供掃描功能。 (4) 提供影像導航功能。
應用於自動影像	應用於手動影像

※實際規格以出貨為準※



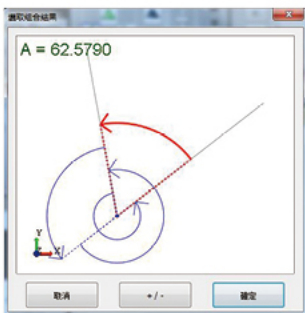
雷射位移器測量



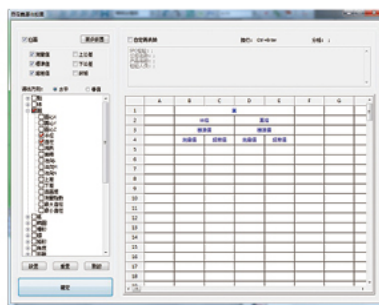
探針量測



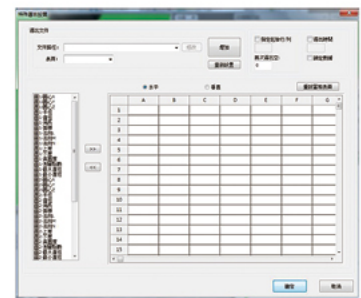
元素複製



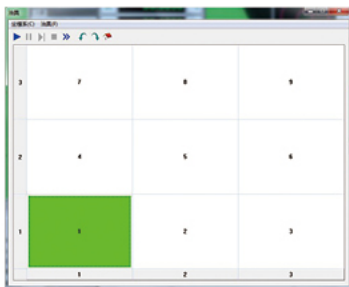
構造多種角度



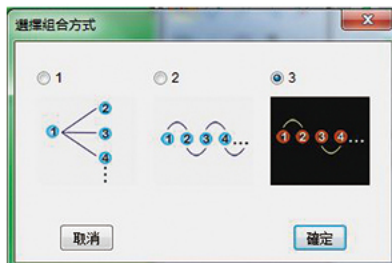
自定義報表設置



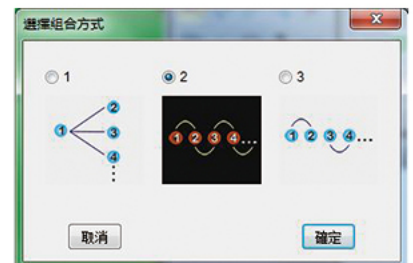
特殊模式報表設置



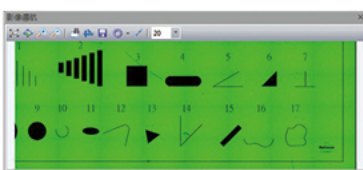
治具量測



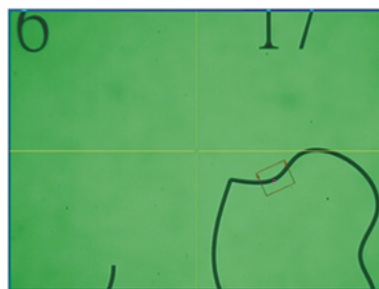
快速組合距離功能



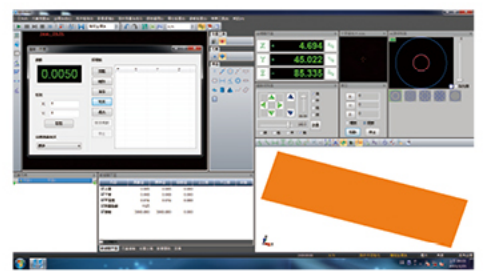
快速組合角度功能



影像導航



尋尖點



雷射掃瞄



***Your Chance , Your Choice
Your Chance Technology CO.,LTD.,***

台灣:台中市西屯區至善路121巷15號1樓 TEL:04-2708-1727

崑山:昆山市玉山鎮城北路5號二棟樓201室 TEL:0512-57986061

EMAIL:urchance@urchancetek.com.tw